УДК 621.317.533.275

(3)

В.Б. Бенедицький, ст. викл. Л.Ю. Козак, аспір. А.В. Яворська, аспір. Житомирський державний технологічний університет

РАДІОХВИЛЬОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ МАТЕРІАЛІВ

(Представлено д.т.н., проф. Манойловим В.П.)

В статті розглянуто радіохвильовий метод вимірювання вологості твердих і сипучих матеріалів, який заснований на просвічуванні матеріалу мікрохвильовим випромінюванням, має нескладну методику вимірювання і є безконтактним методом.

Вступ. Вимірювання вологості сипучих і твердих матеріалів необхідне в багатьох галузях виробництва для контролю технологічних процесів [1, 2]. Визначення вологості шляхом зважування сухого і вологого зразків вимагає тривалого часу [3]. Серед методів, що забезпечують швидке і точне вимірювання вологості сипучих і твердих матеріалів, особливий інтерес представляють безперервні та безконтактні методи, при використанні яких не порушується їх цілісність. Перспективним методом вимірювання вологості матеріалів є радіохвильовий метод [4], заснований на використанні ефекту обертальної релаксації молекул води в НВЧ-полі, що призводить до поглинання енергії електромагнітної хвилі у вологому матеріалі [5, 6]. Висока чутливість радіохвильового методу обумовлена відмінністю діелектричної проникності води і сухого матеріалу. Даний метод отримав широке застосування через можливість отримання простих технічних рішень НВЧ вологомірів при нескладній методиці вимірювань. Перевагою даного методу є безконтактність вимірювань і можливість інтегральної оцінки вологості. Принцип, що лежить в основі даного методу, полягає у вимірювань і можливість три схеми вимірювання вологи – за значенням поглинання енергії НВЧ-поля, значенням фазового зсуву НВЧ коливань і за параметрами відбитої від матеріалу хвилі [4]. Вимірювання вологості за поглинання НВЧ енергії найбільш поширене в практиці НВЧ вологометрії [2, 3].

Постановка завдання. Вимірювання вологості матеріалів на НВЧ характеризується високою точністю і може проводитися без контакту з ними, що дозволяє здійснювати безперервні вимірювання великих об'ємів речовини. НВЧ-вологоміри широко використовуються для вимірювання і контролю вологості сировини, напівфабрикатів і готових виробів як у лабораторних, так і промислових умовах.

Викладення основного матеріалу. Одним із методів вимірювання вологості сипучих і твердих матеріалів є метод, заснований на просвічуванні матеріалу мікрохвильовим випромінюванням, причому вологість визначається по втратах потужності електромагнітної хвилі, що пройшла через зразок матеріалу. Послаблення, яке характеризує втрати НВЧ потужності, є функцією електричних властивостей матеріалу, через який проходить електромагнітна хвиля.

Розглянемо основні положення, які використовуються при подальшому розгляді поставленої задачі. При подальшому аналізі використовуються характеристики лінії передачі (ЛП) заповненої діелектриком з втратами. Тому, для зручності викладення коротко наводимо необхідні дані [7].

Хвильове число *γ* хвилі *H*- або *E*-типу, що розповсюджується в хвилеводі, заповненому діелектриком із втратами, дорівнює:

$$\gamma^2 = \mathbf{X}^2 - \varepsilon^* \mathbf{k}^2, \tag{1}$$

де x – хвильове число поперечного перерізу хвилеводу; k – хвильове число вільного простору; ε^* – комплексна відносна діелектрична проникність, що дорівнює:

$$\varepsilon^* = \varepsilon' - i\varepsilon'' = \varepsilon' (1 - i \mathrm{tg}\delta), \tag{2}$$

де tg $\delta = \frac{\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0 \varepsilon}$ – тангенс кута діелектричних втрат.

Якщо підставити значення (2) у формулу (1), то отримаємо:

$$\gamma = \alpha + i\beta_{\varepsilon},$$

де α – коефіцієнт затухання:

$$\alpha = \frac{k^2 \varepsilon \operatorname{tg} \delta}{2\beta_{\varepsilon}},\tag{4}$$

 β_{ε} – хвильове число:

$$\beta_{\varepsilon}^{2} = k^{2} \left[1 - \left(\frac{x}{k}\right)^{2} \right] \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon'} - \left(\frac{x}{k}\right)^{2}\right)^{2} \right]^{1/2} \right\}.$$
(5)

Якщо $\varepsilon^{''} = 0$, то з (4) випливає звичайна формула для β_{ε} .

Якщо $\varepsilon^{"} \neq 0$, але достатньо мале, порівняно з одиницею (що майже завжди виконується для більшості діелектриків), то формулу (5) можна дещо спростити:

$$\beta_{\varepsilon}^{2} \approx k \sqrt{\varepsilon' - \frac{x^{2}}{k}} \left| 1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon' - \frac{x^{2}}{k}} \right)^{2} \right|.$$
(6)

Якщо не розглядати область значень довжин хвиль, при якій $x^2 \approx \varepsilon'$, то другим доданком в квадратних дужках можна знехтувати:

$$\beta_{\varepsilon}^{2} \approx k \sqrt{\varepsilon' - \frac{x^{2}}{k}}.$$
(7)

При аналізі процесів розповсюдження хвиль вздовж хвилеводу широко використовується поняття хвилевих опорів. Для *H*- і *E*-хвиль ці опори рівні:

$$Z_{H} = \frac{i\omega\rho_{0}}{\gamma}; \ Z_{E} = \frac{\gamma}{i\omega\varepsilon_{0}\varepsilon^{*}}.$$
(8)

Підставивши в ці формули значення γ (3), після перетворень отримаємо:

$$Z_{H} = \frac{\omega\mu_{0}}{\beta_{\varepsilon}} \left[\frac{1 + i\frac{a}{\beta_{\varepsilon}}}{1 + \left(\frac{a}{\beta_{\varepsilon}}\right)^{2}} \right];$$
(9)

$$Z_{E} = \frac{\beta_{\varepsilon}}{\omega \varepsilon \varepsilon_{0}} \left[\frac{1 + \frac{a}{\beta_{\varepsilon}} \operatorname{tg} \delta + i \left(\frac{a}{\beta_{\varepsilon}} - \operatorname{tg} \delta \right)}{1 + \operatorname{tg}^{2} \delta} \right].$$
(10)

 \bot Якщо tg δ малий, то, використовуючи значення для β_{ε} (7) і (5), отримаємо:

$$Z_{H} \approx Z_{H} \left(1 + i \frac{\alpha}{\beta_{\varepsilon}} \right); \tag{11}$$

$$Z_{E} \approx Z_{E}^{'} \left[1 + i \left(\operatorname{tg} \delta - \frac{a}{\beta_{\varepsilon}} \right) \right], \tag{12}$$

де Z'_H і Z'_E – хвильовий опір хвилеводів, заповнених діелектриком без врахування втрат.

Вираз
$$\frac{a}{\beta_{\varepsilon}}$$
 має вигляд:

$$\frac{a}{\beta_{\varepsilon}} = \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{k}{\beta_{0}}\right)^{2} = \frac{\mathrm{tg}\delta}{2} \frac{\varepsilon}{\varepsilon' - \left(\frac{x}{k}\right)^{2}}.$$
(13)

Якщо $\varepsilon' >> 1 > \left(\frac{x}{k}\right)^2$, то $\frac{a}{\beta_{\varepsilon}} \approx \frac{\mathrm{tg}\delta}{2}$ i:

33

$$Z_{H} \approx Z_{H}^{'} \left(1 + i \frac{\mathrm{tg}\delta}{2} \right) \approx Z_{H}^{'} \left(1 + i \frac{a}{\beta_{0}} \right); \tag{14}$$

$$Z_{E} \approx Z_{E}^{'} \left(1 + i \frac{\operatorname{tg} \delta}{2} \right) \approx Z_{E}^{'} \left(1 + i \frac{a}{\beta_{0}} \right).$$
(15)

Розділивши відповідні значення хвильових опорів хвилеводів без діелектриків на вирази (14) та (15), отримаємо нормовані хвильові опори Z'_{H_0} і Z'_{E_0} :

для хвиль Н-типу:

$$Z'_{H_0} \approx Z_{H_0} \left(1 - i \frac{a}{\beta_0} \right), \ Z'_{H_0} = \frac{\sqrt{\varepsilon' - \left(\frac{x}{k}\right)^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{k}\right)^2}};$$
(14')

для хвиль Е-типу:

$$Z_{E_0} \approx Z_{E_0} \left(1 - i \frac{a}{\beta_0} \right), \ Z_{E_0} = \frac{\sqrt{\varepsilon' - \left(\frac{x}{k}\right)^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{k}\right)^2}}.$$
(15')

Розглянемо нескінченний регулярний хвилевід з довільною формою поперечного перерізу (рис. 1). Перпендикулярно до осі хвилеводу розміщена діелектрична пластина, що перекриває хвилевід. Припустимо, що діелектрик, з якого виготовлена пластина, має втрати, а в стінках хвилеводу втрат немає. Нехай зліва на право розповсюджується хвиля одного будь-якого *H*- або *E*-типу.



Рис. 1. Регулярний хвилевід з шаром діелектрика (I, II, III – області хвилеводу)

Запишемо вирази для полів у областях І, ІІ, ІІІ (рис. 1) в такому вигляді:

$$I \text{ область } (-\infty < z \le 0):$$

$$E_t^I = \left[Ae^{+i\beta_0 z} + Be^{+i\beta_0 z}\right] \mathbf{s}_{\mathbf{h},\mathbf{e}}; \quad E_z^I = \left[Ae^{-i\beta_0 z} - Be^{+i\beta_0 z}\right] \mathbf{q}_{\mathbf{e}}; \quad (16)$$

$$H_t^I = \left[Ae^{-i\beta_0 z} - Be^{+i\beta_0 z}\right] \frac{\mathbf{p}_{\mathbf{h},\mathbf{e}}}{Z_1}; \quad H_z^I = \left[Ae^{-i\beta_0 z} + Be^{+i\beta_0 z}\right] \mathbf{q}_{\mathbf{h}}. \quad II \text{ область } (0 \le z \le t):$$

$$E_t^{II} = \left[Ce^{-\gamma z} + De^{+\gamma z}\right] \mathbf{s}_{\mathbf{h},\mathbf{e}}; \quad E_z^{II} = \left[Ce^{-\gamma z} - De^{+\gamma z}\right] \mathbf{q}_{\mathbf{e}}; \quad H_t^{II} = \left[Ce^{-\gamma z} - De^{+\gamma z}\right] \frac{\mathbf{p}_{\mathbf{h},\mathbf{e}}}{Z_2}; \quad H_z^{III} = \left[Ce^{-\gamma z} + De^{+\gamma z}\right] \mathbf{q}_{\mathbf{h}}. \quad (17)$$

III область ($t \le z < +\infty$)

$$E_{t}^{III} = \left[F e^{-i\beta_{0}z} \right] \mathbf{s}_{\mathbf{h},\mathbf{e}}; \ E_{z}^{III} = F e^{-i\beta_{0}z} \mathbf{q}_{\mathbf{e}};$$

$$H_{t}^{III} = \left[F e^{-i\beta_{0}z} \right] \frac{\mathbf{p}_{\mathbf{h},\mathbf{e}}}{Z_{1}}; \ H_{z}^{III} = F e^{-i\beta_{0}z} \mathbf{q}_{\mathbf{h}},$$

$$(18)$$

де A, B, C, D – невідомі амплітуди полів; s, p, q – векторні функції для H- і E-хвиль, що характеризують розподіл поля в поперечному перерізі хвилеводу; β_0, γ – хвильові числа; Z_1, Z_2 – ненормовані хвильові опори.

Множник $e^{+i\omega t}$ у виразах (16)–(18) опущено.

Прирівнюючи тангенціальні складові полів на границях областей I, II, III, отримаємо значення амплітуд:

$$B = \frac{(1-Z^2)sh\theta}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta} A;$$
⁽¹⁹⁾

$$C = \frac{(1+Z)e^{\theta}}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta} A;$$
⁽²⁰⁾

$$D = \frac{-(1-Z)e^{-\theta}}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta} A; \qquad (21)$$

$$F = \frac{2Ze^{t\phi_0}}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta} A, \qquad (22)$$

де $φ_0 = β_0 t$; θ = γt; $Z = \frac{Z_1}{Z_2} = Z'_{H0,E0}$.

Зазначимо, що в прийнятих тут позначеннях константи *B*, *C*, *D*, *F* не мають розмірності поля. Для того, щоб отримати правильну розмірність, необхідно *A* замінити на $\frac{E_0}{z}\sqrt{\frac{s}{2}}$ (S – площа поперечного перерізу хвилеводу; *E* – напруженість електричного поля). Скрізь далі кінцеві результати представлено в безрозмірному вигляді.

Формули для амплітуд (19), (20) справедливі як для H-, так і для E-хвиль. Специфіка цих хвиль заключна в значеннях величин φ , θ і Z, які різні для H- і E-хвиль. Використовуючи значення амплітуд (19)–(22), можна записати формули для тангенціальних складових поля в областях І–ІІІ:

$$\boldsymbol{E}_{t}^{T} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{s}_{h,e}\boldsymbol{e}^{-i\beta_{0}\boldsymbol{z}} + \frac{(1-\boldsymbol{Z}^{2})\boldsymbol{s}h\theta}{(1+\boldsymbol{Z}^{2})\boldsymbol{s}h\theta + 2\boldsymbol{Z}\boldsymbol{c}h\theta} \boldsymbol{A}\boldsymbol{s}_{h,e}\boldsymbol{e}^{i\beta_{0}\boldsymbol{z}}; \qquad (23)$$

$$\boldsymbol{E}_{t}^{"} = 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{s}_{h,e} \frac{\left[\boldsymbol{Z}\boldsymbol{c}\boldsymbol{h}\boldsymbol{\theta}(1-\boldsymbol{\xi}) + \boldsymbol{s}\boldsymbol{h}\boldsymbol{\theta}(1-\boldsymbol{\xi})\right]}{\left(1+\boldsymbol{Z}^{2}\right)\boldsymbol{s}\boldsymbol{h}\boldsymbol{\theta} + 2\boldsymbol{Z}\boldsymbol{c}\boldsymbol{h}\boldsymbol{\theta}};$$
(24)

$$E_t^{III} = 2As_{h,e} \frac{Ze^{i\phi_0}}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta} e^{-i\beta_0 z}, \qquad (25)$$

де $\xi = \frac{z}{t}$.

Аналогічно можна записати вирази і для поздовжніх складових полів E_z і H_z . Зокрема, для поля E_z маємо:

$$E_{z}^{\prime} = Aq_{e}e^{-i\beta_{0}z} + \frac{(1-Z^{2})sh\theta}{(1+Z^{2})sh\theta + 2Zch\theta} Aq_{e}e^{+i\beta_{0}z}; \qquad (26)$$

$$E_{z}^{"} = 2Aq_{e} \frac{\left[ch\theta(1-\xi) + Zsh\theta(1-\xi)\right]}{\left(1+Z^{2}\right)sh\theta + 2Zch\theta};$$
(27)

$$E_z^{III} = 2Aq_e \frac{Ze^{i\varphi_0}}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta} e^{-i\beta_0 z}.$$
(28)

З даних формул випливає, що коефіцієнт відбиття рівний:

$$R = \frac{B}{A} = \frac{(1-Z^2)sh\theta}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta},$$
(29)

а коефіцієнт передачі має вигляд:

$$T = \frac{F}{A} = \frac{2Ze^{i\varphi_0}}{(1+Z^2)sh\theta + 2Zch\theta}.$$
(30)

Таким чином, вирази (23)–(25) для поля і формули для амплітуд хвиль (19)–(22) повністю вирішують завдання з визначення розподілу поля H- і E-хвиль у регулярному хвилеводі з діелектричною пластиною. Можна показати, що формули (29), (30) співпадають з відповідними виразами для коефіцієнта відбиття і передачі для хвиль у вільному просторі [3], відмінність полягає лише в значеннях Z і β , які для H-, E- і TEM-хвиль різні.

Щільність потужності втрат у діелектрику рівна [8]:

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\omega \boldsymbol{e}_0 \boldsymbol{\varepsilon}''}{2} \left| \boldsymbol{\mathcal{E}} \right|^2.$$
(31)

Використовуючи значення сталої затухання a(4) і хвильового числа β_0 (7), формулу (31) можна записати в іншому вигляді:

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\boldsymbol{a}}{\rho} \frac{\beta_0}{k} \left| \boldsymbol{E} \right|^2, \tag{32}$$

де *р* – хвильовий опір вільного простору.

Для хвиль *H*-типу електричне поле поперечне, тому:

$$|E|^{2} = |E_{t}|^{2}.$$
(33)

У випадку Е-хвиль поле містить як поперечну, так і поздовжню компоненти:

$$\left|\boldsymbol{E}\right|^{2} = \left|\boldsymbol{E}_{t}\right|^{2} + \left|\boldsymbol{E}_{z}\right|^{2}.$$
(34)

Розглянемо спочатку випадок H-хвиль. Оскільки у хвилеводі використовуються діелектрики з малими втратами, то при подальшому аналізі доцільно обмежитись лише випадком малих значень $tg\delta$, або, точніше, малих значень at. Враховуючи дане припущення, з формули (24) отримаємо:

$$\left| E_{t}^{"} \right|^{2} = |A|^{2} |s_{h}|^{2} \times \frac{4 \left[Z_{0}^{2} \cos^{2} \varphi(1-\xi) + \sin^{2} \varphi(1-\xi) + 2Z_{0} a l(1-\xi) - Z_{0} \left(\frac{a}{\beta} \right) \sin 2\varphi(1-\xi) \right]}{4 Z_{0}^{2} \cos^{2} \varphi + \left(1 + Z_{0}^{2} \right) \sin^{2} \varphi + 4 Z_{0} a l \left[Z_{0}^{2} + 1 + \left(Z_{0}^{2} - 1 \right) \frac{\sin 2\varphi}{2\varphi} \right]},$$
(35)

де Z_0 – відношення хвильових опорів хвилеводу без діелектрика і хвилеводу з діелектриком без втрат (14'), (15'); $\varphi = \beta_{\varepsilon} t$.

Оскільки окремі доданки малі, то в ряді випадків ними можна знехтувати:

$$E_t'' \Big|^2 = |A|^2 |s_h|^2 \frac{4 \left[Z_0^2 \cos^2 \varphi (1-\xi) + \sin^2 \varphi (1-\xi) \right]}{4 Z_0^2 \cos^2 \varphi + (1+Z_0^2) \sin^2 \varphi}.$$
(36)

Останній вираз зручний для аналізу і в багатьох випадках забезпечує достатню точність. Підставляючи (36) у формулу (32), отримаємо вираз для розподілу щільності втрат:

$$P_{h} = 2a \left(\frac{\beta_{\varepsilon}}{\beta_{0}}\right) \frac{|s_{h}|^{2}}{\int |s_{h}|^{2} ds} \frac{4 \left[Z_{0}^{2} \cos^{2} \varphi(1-\xi) + \sin^{2} \varphi(1-\xi)\right] P_{0}}{4 Z_{0}^{2} \cos^{2} \varphi + (1+Z_{0}^{2}) \sin^{2} \varphi},$$
(37)

де P_0 – потужність хвилі, що падає на діелектрик:

$$P_{0} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{s} \left[E_{t}^{\prime} H_{t}^{\prime} \right] z_{0} ds = \frac{|A|^{2}}{2Z_{1}} \int_{s} |s_{h}| ds, \qquad (38)$$

де z_0 – одиничний вектор.

Якщо електрична товщина діелектрика мала, то з (37) випливає:

$$\boldsymbol{P}_{h} = 2\boldsymbol{a} \left(\frac{\beta_{\varepsilon}}{\beta_{0}}\right) \frac{|\boldsymbol{s}_{h}|^{2}}{\int |\boldsymbol{s}_{h}|^{2} d\boldsymbol{s}} \boldsymbol{P}_{0} \,. \tag{39}$$

Повну потужність втрат *P_{nm}* у вікні можна знайти шляхом інтегрування потужності втрат за об'ємом вікна:

$$\frac{P_{nm}}{P_0} = \int_{\upsilon} \rho d\upsilon \approx \left(\frac{a}{\beta_{\varepsilon}}\right) \left(\frac{\beta_{\varepsilon}}{\beta_0}\right) \times \frac{4\left[Z_0^2 + 1 + \left(Z_0^2 - 1\right)\frac{\sin 2\varphi}{2\varphi}\right]\varphi}{4Z_0^2 \cos^2 \varphi + \left(1 + Z_0^2\right)\sin^2 \varphi + 4Z_0^2 \left(\frac{a}{\beta_{\varepsilon}}\right)\varphi \left[Z_0^2 + 1 + \left(Z_0^2 - 1\right)\frac{\sin 2\varphi}{2\varphi}\right]}.$$
(40)

При малих значеннях електричної товщини діелектрика ($\phi << 1$) з даної формули випливає, що відносна величина потужності втрат рівна:

$$\frac{P_{nm}}{P_0} \approx 2at \left(\frac{\beta_{\varepsilon}}{\beta_0}\right),\tag{41}$$

тобто втрати пропорційні товщині діелектрика t. У випадку великих товщин залежність більш складна. При достатньо великих, але скінченних значеннях $\varphi = \beta_{\varepsilon}, t$ і малих значеннях $at \ll 1$ з формули (41) випливає:

$$\frac{P_{i\delta}}{P_0} \left(\frac{\beta_{\varepsilon}}{a}\right) \approx \frac{4Z_0 \left(1 + Z_0^2\right) \varphi}{4Z_0^2 + \left(1 - Z_0^2\right)^2 \sin^2 \varphi}.$$
(42)

Розглянемо тепер випадок *E*-хвиль. Так само, як і для *H*-хвиль, можна було б проаналізувати квадрат поперечної складової і квадрат поздовжньої складової. Однак, якщо цікавитися лише сумарними втратами, то можна вчинити значно простіше. Із закону збереження енергії випливає, що потужність втрат рівна:

$$\frac{P_{nm}}{P_0} = 1 - |R|^2 - |T|^2,$$
(43)

де |R| і |T| визначаються за формулами (29), (30), які справедливі як для *H*-, так і для *E*-хвиль. Підставивши значення |R| і |T| в (43), отримаємо:

$$\frac{P_{i\delta}}{P_0} = 1 - \frac{\left|1 - Z^2\right|^3 \left|sh\theta\right|^2 - 4\left|Z\right|^2}{\left|\left(1 + Z^3\right)sh\theta + 2Zch\theta\right|^2}.$$
(44)

Ця формула дає можливість розрахувати повні втрати для обох типів хвиль. Обмежуючись випадком малих втрат і використовуючи значення для Z (14'),(15') і для β_{ε} (7) (справедливі при $\varepsilon k^2 >> x^2$), з формули (44) отримаємо результат, що співпадає з (37), тобто як для H-, так і для E-хвиль втрати у вказаному наближенні розраховуються за однією і тією ж формулою (37). Так як поле H-хвиль визначається однією поперечною складовою, а E-хвиль – поздовжньою і поперечною, то співпадання результатів означає, що поздовжня складова напруженості електричного поля в випадку малих втрат (і при $\varepsilon k^2 >> x^2$) вносить незначну величину в загальні втрати, порівняно з поперечною складовою поля. В цьому можна переконатися при безпосередньому аналізі щільності втрат, обумовлених складовими E_t I E_z .

Розподіл втрат у поперечному перерізі визначається векторними функціями *s*, *p*, *q* (16)–(18), які в прийнятих тут позначеннях мають такий вигляд:

для *Н*-хвилі:

$$\mathbf{s}_{h} = \left[\nabla\psi\cdot\mathbf{z}_{0}\right]; \ \boldsymbol{p}_{h} = \nabla\psi_{h}; \ \boldsymbol{q}_{h} = \frac{i\boldsymbol{x}_{h}^{2}}{\omega\mu_{0}}\psi_{h}\cdot\mathbf{z}_{0};$$

$$(45)$$

для Е-хвилі:

$$\boldsymbol{s}_{e} = \boldsymbol{\psi}_{e}; \ \boldsymbol{p}_{e} = \left[\boldsymbol{z}_{0}, \nabla \boldsymbol{\psi}\right]; \ \boldsymbol{q}_{e} = -\frac{\boldsymbol{x}^{2}}{\boldsymbol{\gamma}_{e}} \boldsymbol{\psi}_{e} \cdot \boldsymbol{z}_{0},$$

$$\tag{46}$$

де ψ_h і ψ_e – власні функції хвильового рівняння для поперечного перерізу хвилеводу. Ці функції дійсні, не залежать від властивостей середовища, що заповнює хвилевід і тому на ділянці хвилеводу без діелектрика і з діелектриком однакові. Власні функції ψ визначаються з точністю до константи, яка знаходиться за умови нормування:

$$\int_{s} |\psi_{e,h}|^{2} ds = 1; \quad \int_{s} |\nabla \psi_{e,h}|^{2} ds = x_{e,h}^{2}.$$
(47)

Підставляючи значення векторних функцій (45), (46), у формулу (32), для щільності втрат отримаємо:

$$p_{h} = 2aP_{0}\left(\frac{\beta_{\varepsilon}}{\beta_{0}}\right)\left|\frac{\left|\nabla\psi_{e}\right|^{2}}{x_{e}^{2}}\left|f_{1}(\gamma\xi)\right|^{2}\right],\tag{48}$$

де

$$\left|f_{1}(\gamma\xi)\right|^{2} = 4 \left|\frac{Zch\theta(1-\xi) + sh\theta(1-\xi)}{2Zch\theta + (1+Z^{2})sh\theta}\right|^{2};$$

$$(49)$$

$$\boldsymbol{p}_{e} = 2\boldsymbol{a}\boldsymbol{P}_{0} \left(\frac{\beta_{0}\beta_{\varepsilon}}{k^{2}}\right) \left[\frac{\left|\nabla\psi\right|^{2}}{x_{e}^{2}}\left|f_{1}(\gamma\varepsilon)\right|^{2} + \frac{x_{e}^{2}}{\left|\gamma\right|^{2}}\left|\psi_{e}\right|^{2}\left|f_{2}(\gamma\xi)\right|^{2}\right],\tag{50}$$

де

$$\left|f_{2}(\gamma\xi)\right|^{2} = 4 \left|\frac{ch\theta(1-\xi) + Zsh\theta(1-\xi)}{2Zch\theta + (1+Z^{2})sh\theta}\right|^{2}.$$
(51)

Таким чином, розподіл втрат у поперечному перерізі вікна повністю визначається власною функцією та її градієнтом:

У випадку прямокутного хвилеводу [6] власні функції рівні:

$$\psi_{e.mn} = \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} , \ x^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right);$$

$$\psi_{h.mn} = \sqrt{\frac{(2-\delta_{0m})(2-\delta_{0n})}{ab}} \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}.$$
 (52)

Для круглого хвилеводу:

$$\psi_{e.mn} = \sqrt{\frac{2}{\pi(1+\delta_{0m})}} \frac{J_m \left(\varepsilon_{mn} \frac{r}{a}\right)}{a J_m (\varepsilon_{mn})} \frac{\sin}{\cos} m\varphi, \ x_{e.mn}^2 = \left(\frac{\varepsilon_{mn}}{a}\right)^2;$$

$$\psi_{h.mn} = \sqrt{\frac{2}{\pi(1+\delta_{0m})}} \frac{\mu_{mn}}{a \sqrt{\mu_{mn}^2 - m^2}} \frac{J_m \left(\mu_{mn} \frac{r}{a}\right)}{J_m (\mu_{mn})} \frac{\sin}{\cos} m\varphi, \ x_{h.mn}^2 = \left(\frac{\mu_{mn}}{a}\right),$$
(53)

причому найменші значення коренів ε_{mn} і μ_{mn} дорівнюють: $\varepsilon_{01} = 2,405$; $\varepsilon_{11} = 3,832$; $\varepsilon_{21} = 5,135$; $\mu_{11} = 1,840$; $\mu_{21} = 3,054$; $\mu_{01} = 3,830$.

Розглянемо розподіл щільності втрат для деяких видів хвиль, що використовуються найбільш часто.

Прямокутний хвилевід

Хвиля типу H_{10} . Використовуючи вирази (52) і (48), отримаємо:

$$p_{h10} = \frac{4P_0 a Z_0}{ab} \sin^2 \frac{\pi x}{a} \left| f_1(\beta_{\varepsilon}, \xi) \right|^2.$$
(54)

Максимум щільності втрат розміщений у центрі широкої стінки хвилеводу. По висоті хвилеводу щільність втрат постійна. Як випливає з виразу (54) біля 80 % всієї потужності втрат виділяється в центрі пластини на ділянці шириною $\frac{a}{2}$ (рис. 1).

Хвиля типу E_{11} . Розподіл щільності втрат у даному випадку визначається виразом:

$$p_{e11} = \frac{8aP_0Z_0}{ab} \left[\frac{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \cos^2\frac{\pi x}{a} \sin^2\frac{\pi y}{b} + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 \sin^2\frac{\pi x}{a} \cos^2\frac{\pi y}{a}}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} + \frac{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} \right] + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \frac{1}$$

$$+\frac{\left(\frac{\pi}{a}\right)^{2}+\left(\frac{\pi}{b}\right)^{2}}{\left|\gamma\right|^{2}}\sin^{2}\frac{\pi x}{a}\sin^{2}\frac{\pi y}{a}\left|f_{2}\left(\beta_{\varepsilon},\xi\right)\right|^{2}\right]$$

Розподіл поля по перерізу хвилеводу у випадку *E*-хвилі залежить від довжини хвилі. Зокрема по мірі наближення до критичної довжини хвилі другий доданок (55) збільшується.

Круглий хвилевід

Хвиля типу H_{11} . Використовуючи вираз для власної функції $\psi_{h,11}$ (53) і формулу (48), отримаємо:

$$p_{h11} = \frac{4aP_0Z_0}{\pi a^2 \left(1 - \frac{1}{\mu_{11}^2}\right)} \left[\frac{J_1^2 \left(r \frac{\mu_{11}}{a}\right)}{J_1^2 (\mu_{11})} \cos^2 \varphi + \left(\frac{a}{\mu_{11}r}\right)^2 \frac{J_1^2 \left(r \frac{\mu_{11}}{a}\right)}{J_1^2 (\mu_{11})} \sin^2 \varphi \right] f(\beta_{\varepsilon}, \xi)^2.$$
(56)

Максимум щільності втрат розташований у центрі хвилеводу (рис. 1).

Хвиля типу \boldsymbol{E}_{10} . Розподіл щільності втрат для хвилі E_{10} -типу визначається за формулою:

$$\boldsymbol{q}_{e10} = \frac{2\boldsymbol{a}\boldsymbol{P}_{0}\boldsymbol{Z}_{0}}{\pi\boldsymbol{a}^{2}\boldsymbol{J}_{1}^{2}(\varepsilon_{01})} \left| \boldsymbol{J}_{1}^{2} \left(\varepsilon_{01} \frac{\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{a}} \right) \left| \boldsymbol{f}_{1}(\boldsymbol{\beta}_{\varepsilon}, \boldsymbol{\xi}) \right|^{2} + \frac{\left(\frac{\varepsilon_{01}}{\boldsymbol{a}} \right)^{2}}{\left| \boldsymbol{\gamma} \right|^{2}} \boldsymbol{J}_{0}^{2} \left(\varepsilon_{01} \frac{\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{a}} \right) \left| \boldsymbol{f}_{2}(\boldsymbol{\beta}_{\varepsilon}, \boldsymbol{\xi}) \right|^{2} \right|.$$

$$(57)$$

Виражена в децибелах величина затухання потужності, що пройшла через шар матеріалу в лінії передачі, визначається виразами (9), (10):

$$N = 10 \lg \frac{P_{i\dot{\alpha}\dot{\alpha}}}{P_{i\dot{\alpha}}} = 8,686\alpha t , \qquad (58)$$

де P_{nad} і P_{np} – потужність, що падає на шар матеріалу і проходить через нього.

Стала затухання α є функцією електричних параметрів ε^* і tg δ , які, як було сказано вище, зв'язані з вологістю матеріалу. Звідси випливає, що величина затухання також залежить від вологості матеріалу і може бути мірою його вологості.

Висновки. В даній роботі розглянутий метод вимірювання вологості твердих і сипучих матеріалів.

Якщо діелектрична проникність шару матеріалу така, що $\varepsilon' \ge 1 \ge \left(\frac{x}{k}\right)^2$ і малі втрати, то першому

наближенні, стала затухання для всіх типів хвиль і форм ліній передачі визначається лише діелектричною проникністю, тангенсом кута втрат і довгої хвилі. Щільність втрат розподілена неоднорідно за товщиною шару матеріалу. Розподіл втрат по поперечному перерізі шару матеріалу нерівномірний. При малій товщині шару матеріалу величина повної потужності втрат пропорційна товщині (*t*) коефіцієнта затухання і відношенню хвильових опорів лінії передачі без матеріалу і матеріалом.

ЛІТЕРАТУРА:

- 1. *Мелкумян В.Е.* Обеспечение единства измерений влажности твердых материалов / *В.Е. Мелкумян.* М., 1975. 120 с.
- Кричевский Е.С. Высокочастотный контроль влажности при обогащении полезных ископаемых / Е.С. Кричевский. – М.: Недра, 1972. – 238 с.
- 3. Бензарь В.К. Техника СВЧ влагометрии / В.К. Бензарь. Минск : Высшая школа, 1974. 185 с.
- 4. Викторов В.А. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов / В.А. Викторов, Б.В. Лункин, А.С. Совлуков. М. : Энергоатомиздат, 1989. 206 с.
- 5. Федоткин И.М. Физико-технические основы влагометрии в пищевой промышленности / И.М. Федоткин, В.П. Клочков. – К. : Техника, 1974. – 152 с.
- 6. *Ястребов О.И.* Применение техники СВЧ в целюлозно-бумажном производстве / *О.И. Ястребов.* – М. : Лесная промышленность, 1977. – 220 с.
- 7. *Митрохин В.Н.* Электродинамика и распространение радиоволн / В.Н. Митрохин. М. : Рудомино, 2010. 210 с.

- 8. Электродинамика и распространение радиоволн / В.А. Неганов, О.В. Осипов, С.Б. Раевский и др. М. : Радио и связь, 2009. 774 с.
- 9. *Митрохин В.Н.* Электродинамические свойства материальных сред / *В.Н. Митрохин.* М. : Изд-во МГТУ им. М.Э. Боумана, 2011. 150 с.
- 10. *Гридин В.Н.* Электродинамика структур крайневысоких частот / В.Н. Гридин, Е.И. Нефедов, Т.Ю. Черникова. М. : Наука, 2002. 359 с.

БЕНЕДИЦЬКИЙ Василь Борисович – старший викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- радіохвильові методи вимірювання.

КОЗАК Лілія Юріївна — аспірант кафедри радіотехніки та телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- радіохвильові методи вимірювання;
- вимірювання вологості матеріалів.

ЯВОРСЬКА Анна Валеріївна – аспірант кафедри радіотехніки та телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- радіохвильові методи вимірювання;
- вимірювальна апаратура.

Подано 19.10.2011